MARUWA

性能及测试方法

■性能及测试方法

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">项目</th><th>性能</th><th rowspan="2">性能及测试方法及条件
（根据JIS C 5101-1）</th></tr>
<tr><th>X5R 特性</th></tr>
<tr><td colspan="2">静电容量</td><td>允许差以内</td><td rowspan="2">CLASS 2
<table><tr><th>标称静电容量</th><th>测定频率</th><th>测定电压</th></tr><tr><td>C≦10μF</td><td>1kHz±10%</td><td>1.0±0.2Vrms</td></tr><tr><td>C>10μF</td><td>120Hz±10%</td><td>0.5±0.2Vrms</td></tr></table>测量前进行热处理</td></tr>
<tr><td colspan="2">介电损耗因数</td><td>10%以下</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐电压</td><td>无绝缘击穿，无破损</td><td>施加电压　：1~5秒間
在硅油中施加电压(W.V.630V以上)
充放电电流　：50mA以下
施加电压　：额定电压×250%</td></tr>
<tr><td colspan="2">绝缘阻抗</td><td>10,000MΩ或500MΩ・μF任意小的一方值以上</td><td>施加电压压　：额定电压
施加时间　：1分钟</td></tr>
<tr><td rowspan="2">粘附强度</td><td>引线接合</td><td>0.03N以上</td><td>用Φ25μ的Au线进行引线接合贴装后，
再测量引线的强度</td></tr>
<tr><td>固晶</td><td>2N以上</td><td>用Au/Sn焊料贴装产品，在水平方向施力。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">温度循环</td><td>外观</td><td>无明显机械损伤</td><td rowspan="5">常温→最低使用温度→常温→最高使用温度
3分钟 → 30分钟 → 3分钟 → 30分钟
依次将电容置于上述1~4个阶段中为一个循环
此操作进行五个循环</td></tr>
<tr><td>静电容量变化率</td><td>±7.5%以下</td></tr>
<tr><td>Q及介电损耗因数</td><td>满足初始值</td></tr>
<tr><td>绝缘阻抗</td><td>满足初始值</td></tr>
<tr><td>耐电压</td><td>无绝缘破坏及破损</td></tr>
<tr><td rowspan="4">耐湿负荷</td><td>外观</td><td>无明显机械损伤</td><td rowspan="4">进行电压处理
测试温度：40±2℃
相对湿度：90~95%RH
测试電压：额定电压
测试時間：500時間</td></tr>
<tr><td>静电容量变化率</td><td>±12.5%以下</td></tr>
<tr><td>Q及介电损耗因数</td><td>初始值的2倍以下</td></tr>
<tr><td>绝缘阻抗</td><td>1,000MΩ或50MΩ・μF任意小的一方值以上</td></tr>
<tr><td rowspan="4">高温负荷</td><td>外观</td><td>无明显机械损伤</td><td rowspan="4">进行电压处理
测试温度：85±3℃
相对湿度：额定电压×150%的直流电压
测试时间：1000小时
测试条件,根据品种不同.详细请确认个别工艺书.</td></tr>
<tr><td>静电容量变化率</td><td>±12.5%以下</td></tr>
<tr><td>Q及介电损耗因数</td><td>初始值的2倍以下</td></tr>
<tr><td>绝缘阻抗</td><td>1,000MΩ或50MΩ・μF任意小的一方值以上</td></tr>
</table>

注１：品种不同性能规格会有差异。详细请确认个别的规格书。
注２：热处理需要在150+0/-10℃、1小时后，从室温中取出，放置48±4个小时。
注３：电压处理要在规定的试验条件下进行，1小时处理后，从室温中取出放置48±4个小时。